IoTデバイスのための設計・試作開発拠点 R&D platforms of design and production for IoT devices

概 要

- ロ 高度なデバイスの試作開発拠点
 - Development platforms for production of advanced devices
- 新材料、新構造に対応した新世代Technology CAD等を整備した設計拠点Design platforms with technology CAD for advanced materials and structures
- は 様々な企業の方のIoT産業への新規参入をお手伝いSupport of new entry in IoT industry for many companies

開発拠点の紹介

Introduction of R&D platforms

IoTデバイス・システムのアイデアを、サンプル試作を経て量産化へと繋げる事業化プロセスを支援するため、設計・試作開発のためのオープンプラットフォームの構築を進めています。特に、省スペースを必要とするIoTデバイスの開発には、異なる機能を持つで、の開発には、異なる機能を持つでは、シュールチップやウエハー同士を3次元的に積み重ねて、実装・システム化可に積み重ねて、実装・システム化研の既存装置をベースとして、必要な装置れています。2018年度公開の予定です。

中小企業・ベンチャーファブレス企業 IoTデバイス・システム 半導体設計 会社 アイディア (企画) 設計·製造拠点 産総研 **AIST** ✓ デバイス設計 ✓ 生産ファブの 製造拠点 工厂 低い開発自由度 設計拠点 ✓ 試作・生産ライン のコスト負担 ✓ 専門人材の 国内外 ファブ サンプル試作 少量生産(約款制度) 量産化·実用化 IoTオープンイノベーション拠点

IoT技術の研究開発のためのオープンイノベーション拠点のイメージ Schematic illustration of an open innovation platform for IoT technology R&D

TIAにおける設計・製造の実例

Examples of design and production of devices in TIA

- > 300 mmシリコンウエハを用いた半導体デバイスプロセスと3次元実装プロセス
- > 外部ファブで作製した300 mmウェハ上のデバイスに新材料・新構造デバイスのインテグレーション技術
- > 300 mmラインによるシリコンフォトニクスデバイス作製技術
- ▶ 電子線リソグラフィーによるナノ構造作製技術
- > 200/300 mmウェハを用いたMEMS集積化・評価技術
- > 新材料・新原理デバイス用新世代TCAD
- ➤ 本拠点整備事業は、NEDOによる「IoT技術開発加速のためのオープンイノベーション推進事業 (平成28~29年度)」に参画。



Advanced Technology CAD



ArF液浸露光装置 ArF Immersion Lithography



ウェハ接合装置 300mm Wafer Bonding



Edge trimming for

300mm wafer

